

19 Zoll Testsystem



be flexible

SPARROW

MTS 30



- > Bis zu 1.152 Pins
- > Kleiner Flächenbedarf – 19 Zoll tragbares Rack
- > Sehr flexible Einsatzmöglichkeiten
- > Einfache Integration in In-Line-Systeme und/oder 19 Zoll Racks
- > Schnellwechselschnittstelle für einfache Wartung
- > Analoger und digitaler In-Circuit-Test (Low Voltage Technologie), Funktionstest, EOL-Test, Boundary Scan
- > 1:1 nicht gemultiplexte Pinarchitektur
- > Als Lambda edition für echtes Paralleltesten erhältlich



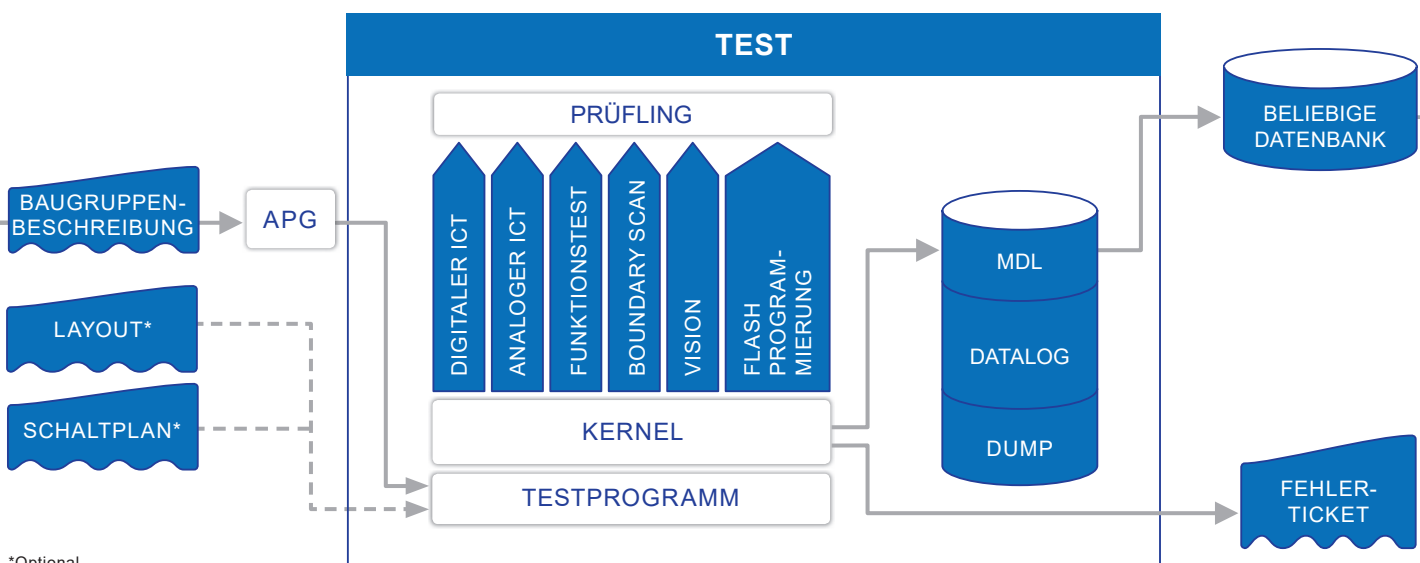
Der Sparrow bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Testfähigkeit bei geringem Platzbedarf.

Testsystem Software



CITE

COMPUTER INTEGRATED
TEST ENVIRONMENT



*Optional



Sparrow Hardware Basissystem

19 Zoll Gehäuse	
483 mm Breite x 178 mm Höhe x 570 mm Tiefe	
Steuerung	
Industrie PC	
AMU Modul (ICT Messung)	
Vier-Quadrant-Messungen	
Guard Verhältnis	1:1000
3 Spannungsquellen	(AC/DC) 0 - 100 V
Frequenz	DC - 100 kHz
Strom	Bis zu 250 mA
Messung	
Spannung	(AC/DC) bis zu 100 V
Strom	(AC/DC) bis zu 100 mA
Widerstände	0,1 Ohm - 100 MOhm
Kondensatoren	1 pF - 100 mF
Induktivitäten	10 µH - 10 H
Kelvin Messung	
Diode und Zener Diode vorwärts und rückwärts bis zu 100 V	
Transistor, Optokoppler usw. im aktiven Test	

Analoges oder hybrides System

Bis zu 1.152 Pins in 128er-Schritten	
MUX Modul (Analoger ICT)	
6-Bus Durchschalteinheit für je 128 Pins	
Hybrider digitaler Treiber/Sensor	
Bis zu 1.152 Pins in 64/128er-Schritten	
Input/Output	+5 V/±10 V in 20 mV Auflösung
Max. Strom	±500 mA (Backdriving) oder 50 mA für den statischen I/O Betrieb
Geschwindigkeit	Bis zu 10 MHz Pattern Rate
Tri-State Fähigkeit/Treiber-Pegel-Überwachung/Pegel pro Pin programmierbar	

Hardware-Optionen

UPC Modul (Programmierbare Spannungsquellen)	
Kurzschlussüberwachung über Soft- und Hardware	
Ausgang per Software zu- und abschaltbar	
Getrennte Force- und Sense-Leitungen	
Thermische Abschaltung	
UPC02-09	9 V / 10 A
UPC02-25	24 V / 5 A
UPC02-45	45 V / 3,5 A
MTC Modul (Frequenz-/Zeitmesseinheit)	
Bis zu 100 MHz	
MSM Modul (DC/AC Strom-/Spannungsstimuli)	
Zusätzliche exakte U/I-Signalquellen (potentialfrei)	
Zusätzliche exakte U/I-Messung (potentialfrei)	
FailSim Modul (Überprüfung der Testprogrammqualität)	
Verbessert die tatsächliche Fehlererkennung eines Testprogramms	
Externe Module	
Zum Beispiel IEEE, PXI, USB, RS232, CAN, LIN uvm.	

Testsystem-Software (inklusive)

Programmentwicklung	
Automatische Programm Generierung (APG) erstellt das Testprogramm aus der Baugruppenbeschreibung.	
Bibliothek für analoge und digitale IC's.	
Funktionstests erstellen mit Menu Aided Programming (MAP).	
Programmiercode des Testprogramms in Visual Basic (VB) 6, VB.NET und/oder als tabellenbasiertes GenFast.	
Übersetzung der Testprogramme von gängigen Testsystemen und der gesamten MTS-Serie.	
Aufzeichnung aller Testergebnisse für die Rückverfolgbarkeit (Fehlerdaten und/oder komplette Messwerte).	
Programm Debugging	
Leistungsfähiges Debugging mit dem tabellenbasierten GenFast (vor allem für analoge ICT) und/oder alle Funktionen die in VB 6 und VB.NET zur Verfügung stehen.	
Einzelschritt-Modus verfügbar.	
Debug-Fenster zur Anzeige der Messergebnisse.	
Alle Befehlsparameter können verändert und die Auswirkungen direkt sichtbar gemacht werden.	
Der Layout- und Schaltplan-Viewer (optional) sowie die Hervorhebung von fehlerhaften Komponenten erleichtern das Debuggen.	
Selbsttest	
Prüft die Hardware und lokalisiert fehlerhafte Module (Diagnose auf Relais-Ebene).	
QCAM (Teststabilitätsbericht)	
Berichtet über die Testprogrammqualität und -stabilität; macht das Debuggen einfach und effizient.	

Software-Optionen

C-LINK Software (Design to Manufacturing)	
Erstellt automatisch Adapterdaten, Netzlisten, Stücklisten, Layoutdaten usw.	
QMAN Software (Paperless Repair)	
Papierlose Reparatur, Statistiken, Qualitätsdatenmanagement, Fehlerkatalog	
Boundary Scan	
Integration Boundary Scan: Entwicklung, Umsetzung und Diagnose.	

Das Unternehmen

Seit 1980 ist Digitaltest ein starker Partner der Elektronikindustrie und verfügt über jahrelange Erfahrung in der Entwicklung, Implementierung und Unterstützung automatisierter Testsysteme (ATE) für bestückte Leiterplatten. Das komplette Leistungsspektrum umfasst neben Technik und Hardware auch die notwendige Software zur Automatisierung der Produktion bis hin zur Qualitätsmanagement-Software.

Digitaltest GmbH

Lorenzstr. 3
76297 Stutensee
Telefon +49 7244 9640-0
E-Mail info@digitaltest.com

